

EXTREME OBERFLÄCHE

1nm

Neue Ausrüstung

ToF-SIMS

Eine ToF-SIMS Analyse ist eine Technik zur Analyse extremer Oberflächen mittels Massenspektroskopie, mit der die chemischen Bestandteile eines Materials auf der Nanometerskala identifiziert werden können. Diese Technik bietet eine hohe Auflösung, eine hohe Empfindlichkeit und ermöglicht eine detaillierte Analyse der Probenoberfläche.

Unsere hochmoderne Ausrüstung ermöglicht

- Die Zusammensetzung einer Oberflächenverschmutzung zu identifizieren.
- Den Ursprung des Defekts genau zu bestimmen.
- Die Integrität einer Oberflächenbehandlung oder -funktionalisierung zu validieren.

CHARAKTERISTIKEN IONTOF M6

- Informationstiefe von 1 nm
- Erhöhte räumliche Auflösung (bis zu 50 nm).
- Atomare und molekulare Identifikation
- Hohe Empfindlichkeit bis zu PPM
- Für alle Arten von Materialien (auch harte).
- Profilierung durch Argon-Aggregate
- Profil in der Dicke und Multilayer
- 3D-Kartierung
- FIB-Schnitt 45°.
- Große Vielseitigkeit



Beherrschung der Ausrüstung,
Interpretation der Ergebnisse
Begleitung auf dem Weg zur Lösung

Effizienz, Qualität, Lösung

November 2023



MATERIA
NOVA Materials
R&D Center

Kontakt :

characterisations@materianova.be

www.materianova.be